СПЕКТРОСКОПИЯ КОНДЕНСИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ

УДК 535.34

МОЛЕКУЛЯРНЫЕ ИОНЫ F₃ В КРИСТАЛЛАХ ФТОРИДОВ

© 2016 г. Е.А. Раджабов

Институт геохимии им. А.П. Виноградова Сибирского отделения РАН, 664033 Иркутск, Россия Иркутский государственный университет, 664003 Иркутск, Россия E-mail: eradzh@igc.irk.ru Поступила в редакцию 21.06.2015 г.

Исследованы спектры поглощения молекулярных ионов F_3^- в кристаллах LaF₃, SrF₂, CaF₂, BaF₂ с редкоземельными активаторами в ультрафиолетовой области. Сравнением спектров радиационно

и аддитивно окрашенных кристаллов выявлены полосы поглощения дырочных F_3^- -центров, расположенные около 6 эВ. Неэмпирические расчеты оптических переходов находятся в хорошем согласии с экспериментальными величинами.

DOI: 10.7868/S0030403416010189

ВВЕДЕНИЕ

Однозарядные молекулярные ионы X_3^- (X-Cl, Br, J) изучены в газовой фазе, растворах и ионных кристаллах [1, 2]. Основываясь на подобии спектров поглошения облученных шелочно-галоидных кристаллов и растворов, полосы поглощения в области 5-6.2 эВ приписаны поглощению ионов Cl₃, Br₃, I₃ [3, 4]. Различают три типа Х₃-центров в щелочно-галоидных кристаллах: V_2, V_3, V_4 . В галоидах калия центры V_2 образуются облучением при 100 K, а V₄ и V₃ – при температурах 200 и 300 К соответственно [5]. Низкотемпературные V₂- и V₄-центры обладают дихроизмом поглощения. Предполагается, что в V₃-центр представляет собой изолированный ион Х₃, а в центрах V_2 и V_4 рядом с молекулярным ионом располагается одна или две вакансии [5].

Тригалоидные молекулярные ионы F_3^- , $Cl_3^$ получены соосаждением галоидов натрия и цезия с аргоном в соотношении 1/400 при 15 К [6]. Полоса поглощения Cl_3^- обнаружена около 4.9 эВ, тогда как в образцах с F_3^- поглощение начиналось около 6.2 эВ с ростом в сторону меньших длин волн. Расстояние между фторами в ионе F_3^- оценено в 1.55 Å [6], неэмпирические расчеты дают несколько большее расстояние 1.74 Å [1, 2]. Относительно недавно F_3^- обнаружены в газовой фазе методом электронно-захватной масс-спектрометрии [7]. Энергия диссоциации F_3^- на F^- и F_2 равна 1.02 эВ, что делает проблематичной существование F_3^- в водных растворах [8].

Полоса поглощения F_3^- в CaF₂–Tm, CaF₂–Dy расположена при 6.0 эВ [9]. В этих кристаллах тригалоидные центры образовывались под действием рентгеновского облучения при температурах выше 100 К [9]. В то же время полоса поглощения трифторидных молекул в LiF обнаружена в существенно более коротковолновой области при 11 эВ [10, 11]. В кристаллах SrCl₂–K⁺ [12] цен-

тры Cl_3^- относительно легко переориентировались при освещении поляризованным светом вдоль главной оси кристалла, что приводило к почти полному дихроизму в полосе поглощения этих центров при 4.7 эВ.

Процессы образования стабильных дырочных центров являются необходимым звеном в понимании деталей радиационного окрашивания галоидных кристаллов. В настоящей работе исследовано образование стабильных до $300-500^{\circ}$ С трифторидных молекулярных ионов F_3^- в кристаллах фторидов (LaF₃, CaF₂, SrF₂, BaF₂).

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

Кристаллы фторидов выращивались методом Стокбаргера в трехствольном графитовом тигле в вакууме¹. Несколько процентов CdF_2 добавлялось в сырье для очистки от примеси кислорода. Концентрация примеси фторидов лантаноидов в шихте была 0.01, 0.1 и 0.3 моль %. Спектры погло-

¹Кристаллы выращены В.А. Козловским.



Рис. 1. Спектр поглощения кристаллов $LaF_3-0.3\%$ YbF₃ при комнатной температуре, наведенный рентгеновским излучением. Указаны предполагаемые полосы F₃⁻ и Yb²⁺-центров. Провал около 5 эВ обусловлен преобразованием ионов Ce³⁺.

щения в области 190—3000 нм измерялись на спектрофотометре Perkin-Elmer Lambda-950², спектры в области вакуумного ультрафиолета измерялись на лабораторной установке с использованием монохроматора BMP2 (115—300 нм). Источником вакуумного ультрафиолета являлась разрядная дейтериевая лампа L7292 (Hamamatsu), приемником излучения был ФЭУ142.

Радиационное облучение производилось с помощью рентгеновской трубки БХВ-12 при напряжении 40 кВ и токе 20 мА в течение 40 мин. Образцы размещались непосредственно на выходном окне рентгеновской трубки и окрашивались с двух сторон.

Аддитивное окрашивание кристаллов осуществлялось в автоклаве из нержавеющей стали при температурах 700-850°С. Образцы кристаллов и кусочки металлического кальция помещались в разные контейнеры. После герметизации и вакуумирования до 10⁻² торр автоклав опускался в печь. После нагрева до желаемой температуры автоклав с образцами выдерживался в печи в течение 1-3 ч в зависимости от толщины образцов и температуры окрашивания. Поверхность образцов SrF_2 и BaF_2 в результате окрашивания становилась мутной, образцы полировались заново. Кристаллы фторида лантана как беспримесные (см. также [13]), так и с примесью редких земель после окрашивания становились серыми. В микроскоп было видно появление металлических частиц (очевидно, La) по всему объему образцов. Нагревание аддитивно окрашенных кристаллов фторида лантана до 700–900°С с последующей закалкой уменьшало количество металлических частиц, но не приводило к появлению окраски.

Неэмпирические расчеты кристаллических кластеров проведены пакетом Gaussian [14] методом функционала плотности (DFT) с гибридным потенциалом B3LYP и базисами 6N311G(d, p) (для CaF₂) и LANL2DZ для LaF₃. Энергии оптических переходов рассчитаны методом TDDFT (time dependent density functional theory).

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Фторид лантана

В кристаллах LaF_3 с примесью редкоземельных ионов RE^{3+} (Yb, Tm, Sm, Ho) при рентгеновском облучении при комнатной температуре образуются центры с интенсивной полосой поглощения с максимумом при 6.2 эВ (рис. 1).

В спектрах поглощения кристаллов LaF₃ обнаружены полосы 6.46, 6.02, 5.69, 5.30 и наибольшая при 5.0 эВ, принадлежащие ионам Ce³⁺ [24]. Следовая концентрация церия в кристаллах LaF₃ была оценена путем сравнения их спектров поглощения со спектром LaF₃–0.01% CeF₃ и составляла 0.001–0.005 моль %. Под действием рентгеновского облучения небольшая доля ионов Ce³⁺ меняла валентность, что проявлялось в спектрах наведенного поглощения (рис. 1, провал при 5.0 эВ).

Наиболее отчетливо полоса при 6.2 эВ измеряется в кристаллах LaF₃-YbF₃. С увеличением концентрации трехвалентного редкоземельного иона растет полоса при 6.2 эВ (при одинаковой дозе облучения). Параллельно с образованием ультрафиолетовой полосы при 6.2 эВ в кристаллах LaF₃ с примесью YbF₃, TmF₃, SmF₃, NdF₃ наводятся также слабые полосы в области 0.5-4 эВ, которые будем называть длинноволновыми полосами. Каждая примесь образует свои характерные длинноволновые полосы поглощения, а положение и ширина полосы при 6.2 эВ остаются неизменными. Длинноволновые полосы поглощения в облученных кристаллах LaF₃-SmF₃ обусловлены переходами в двухвалентных редкоземельных ионах, создающихся ионизирующим излучением. Длинноволновые полосы поглощения в LaF₃ как минимум на порядок меньше полосы при 6.2 эВ (рис. 1).

При нагревании облученного кристалла LaF_3 -0.3% YbF₃ полоса при 6.2 эВ разрушается в интервале температур 350–650°С. При освещении кристаллов LaF_3 -YbF₃ светом разрядной дейтериевой лампы ДДС30 полоса наведенных F_3^- -цен-

² Оборудование Байкальского аналитического центра коллективного пользования СО РАН.



Рис. 2. Сравнение спектров поглощения кристаллов CaF_2 –YbF₃ (a), SrF₂–YbF₃ (b) и BaF₂–YbF₃ (b), наведенных рентгеновским излучением (2), и спектров, полученных аддитивным окрашиванием (1).

тров обесцвечивалась параллельно с полосами Yb²⁺-центров при 4.0 и 3.35 эВ. Дихроизм полосы при 6.2 эВ, представляющий собой разность спектров поглощения, измеренных через поляризатор, направленный вдоль главной оси кристалла и поперек нее, не обнаружен.

Щелочно-земельные фториды

В кристаллах щелочно-земельных фторидов с примесью трехвалентных редкоземельных ионов рентгеновское излучение при комнатной температуре наводит электронные центры — ионы RE²⁺ и дырочные центры — F_3^- , V_{kA} . Появление F_3^- -полосы маскируется сильными полосами двухвалентных ионов RE²⁺ в области 6.2 эВ. В предыду-

щей работе разделение общего поглощения в об-

ласти 5–8 эВ на поглощение F_3^- и поглощение Tm^{2+} проводилось сравнением спектров поглощения кристаллов, облученных рентгеновским излучением, и спектров аддитивно окрашенных кристаллов [9]. В области около 6.2 эВ Yb²⁺ дает меньший вклад в общее поглощение, чем Tm^{2+} . Это предоставило нам возможность более надежно выделить поглощение дырочных F_3^- -центров в кристаллах CaF₂ – 0.1% YbF₃ (максимум 6.08 эВ, полуширина 2.03 эВ) (рис. 2а). В кристаллах SrF₂–0.1% YbF₃ полоса молекулярных ионов F_3^- находится при 6.0 эВ с полушириной 1.7 эВ (рис.26). Помимо основных дырочных центров F_3^- в кристаллах при комнатной температуре на-



Рис. 3. Полная энергия (1), энергия оптического перехода (2) и сила осциллятора (3) линейного молекулярного иона F₃⁻.

водятся дырочные центры $(F_2^-)_{ii}$ с полосой около 4.1 эВ [23], которые можно удалить нагревом до 100—120°С (см. также [9]). Полосы поглощения двухвалентных ионов и дырочных центров F_3^- в кристаллах щелочно-земельных фторидов примерно одинаковы по величине (рис. 2).

В аддитивно окрашенных кристаллах BaF₂-Yb в области выше 5.5 эВ наблюдается сильное поглощение неизвестной природы (рис. 2в). Похожие сильные полосы поглощения наблюдаются также при 7.8 эВ в CaF₂ (рис. 2а) и 7.0 эВ в SrF₂ (рис. 2б). Подобное поглощение при энергиях фотонов выше 5.5 эВ наблюдалось нами в аддитивно окрашенных кристаллах BaF₂ с различными редкоземельными ионами (Sm, Nd, Ho, Tm, Er, Gd, Lu), а также и в беспримесных кристаллах. Ранее сильный рост поглощения выше 5.5 эВ наблюдался в аддитивно окрашенных кристаллах ВаF₂-Nd [15]. При нагревании аддитивно окрашенных кристаллов BaF2-Tm ультрафиолетовое поглощение разрушалось около 800°C с разрушением всех других полос. Ультрафиолетовое поглощение в BaF₂ накладывается на поглощение

F₃-центров, что не позволяет выделить полную

полосу F_3^- из сравнения спектров радиационно и аддитивно окрашенных кристаллов (рис. 3). В то же время подобие спектров поглощения BaF_2 -Yb в интервале 4–5.5 эВ (рис. 2в) и спектров CaF_2 -Yb, SrF_2 -Yb (рис. 2а, 2б) позволяет сделать вывод,

что полоса F_3^- в BaF₂ также находится около 6 эВ.

РАСЧЕТЫ

Впервые схема молекулярных орбиталей тригалоидных однозарядных ионов в нынешней форме предложена Пиментелом [16]. Расчетам электронных и колебательных уровней ионов тригалоидов X_3^- посвящено большое количество работ (см., например, [1, 2, 17–20]). Атомные p_z -орбитали крайних фторов образуют наивысшую занятую σ_g -орбиталь, а p_z -орбитали трех фторов образуют наинизшую незанятую σ_u -орбиталь. Электронная конфигурация основного состояния σ_g^2 , что соответствует терму ${}^{1}\Sigma_g$, конфигурация возбужденного состояния $\sigma_g^1 \sigma_u^1$, что соответствует терму ${}^{1}\Sigma_u$.

Неэпирический расчет линейного иона F₃ указывает на небольшой вклад s- состояний центрального фтора в наивысшую занятую σ_e-орбиталь. Незанятая ои-орбиталь образована тремя разнонаправленными pz-орбиталями фторов. Переход ${}^{1}\Sigma_{g} - {}^{1}\Sigma_{u}$ является разрешенным дипольным переходом с высокой силой осциллятора 1-2 и ориентацией перехода вдоль оси молекулы. Равновесное расстояние между соседними фторами равно 1.75 Å, заряды крайних фторов –0.45, а центрального фтора -0.1, энергия оптического перехода 7.16 эВ. С уменьшением равновесного расстояния полная энергия сильно возрастает, увеличивается также энергия основного перехода ${}^{1}\Sigma_{g} - {}^{1}\Sigma_{u}$ и сила осциллятора основного перехода (рис. 3).

Основываясь на фотодиссоциации F_3^- -центров в CaF₂ на H- и V_k -центры, предложена модель F_3^- -центра как молекулярного иона, образованного междоузельным атомом фтора и двумя узельными фторами с осью молекулы вдоль большой диагонали куба фторов [9]. Расчет подходящего для этой модели кластера (Ca₆F₉)⁵⁺ показал,

ОПТИКА И СПЕКТРОСКОПИЯ том 120 № 2 2016

что расстояние F-F в молекулярном ионе $F_3^$ уменьшается от начального 2.37 до 1.73A (сдвиг на 0.64 Å) за счет образования связи F-F-F, что близко к расчетному расстоянию в свободном ионе

 F_3^- . Энергия оптического перехода ${}^1A_{1g} - {}^1A_{2u}$ (соответствующего ${}^1\Sigma_g - {}^1\Sigma_u$ в свободном ионе) равна 6.52 эВ, что близко к экспериментальной величине 6.08 эВ. Сила осциллятора перехода 0.36.

В то же время измерениями дихроизма погло-

щения Cl_3^- -центров в кристаллах $SrCl_2$, имеющего решетку типа флюорита, убедительно установлена ориентация этих центров по оси 100 [12]. В свя-

зи с этим мы рассчитали также свойства F_3^- -центра в CaF₂, ориентированного вдоль оси четвертого порядка. Междоузельный фтор помещен между двумя ближайшими фторами с начальным расстоянием между соседними фторами 1.37 Å. В процессе оптимизации геометрии кластера Ca₆F₁₃

расстояние между соседними фторами в F_3^- центре увеличилось до 1.88 Å, что соответствовало сдвигу крайних фторов на 0.52 Å относительно положения в невозмущенной решетке. Расчетный максимум полосы поглощения ${}^{1}\Sigma_{g} - {}^{1}\Sigma_{u}$ находится при 5.7 эВ с силой осциллятора перехода 0.8. В настоящее время невозможно сделать определенный выбор между двумя ориентациями

 F_3^- -центров в Ca F_2 , необходимы измерения дихроизма.

Имеется несколько возможных ориентаций молекулярных ионов F_3^- в решетке LaF₃. Отталкиваясь от предположения о направлении F_3^-

вдоль главной оси кристалла, выбран кластер La_5F_{20} , в котором междоузельный фтор помещен между двумя узельными фторами, направленными по оси *Z*. Наибольшее искажение решетки вызывает междоузельный фтор, смещающий соседние два фтора и следующие два иона лантана от центра по оси *Z*. Равновесное расстояние между фторами в ионе F_3^- равно 1.71 Å. Для расчета оптического перехода кластер уменьшен до La_5F_{12} . Длина волны оптического перехода, соответствующего ${}^{1}\Sigma_g - {}^{1}\Sigma_u$ в свободном ионе, равна 6.36 эВ, что близко к экспериментальной величине 6.2 эВ.

ОБСУЖДЕНИЕ

Сила осциллятора перехода равна 1.3.

Полоса при 6.2 эВ, образованная рентгеновским излучением при комнатной температуре, одинакова в кристаллах LaF_3 с примесью разных трехвалентных лантаноидов (Yb, Tm, Sm, Ho). Следовательно, полоса при 6.2 эВ соответствует поглощению собственных центров, каковыми и являются молекулярные ионы F_3^- . По положению и полуширине полосы F_3^- -центров в разных фторидах близки между собой. Это обусловлено сильной молекулярной связью в ионе трифторида. Энергия перехода ${}^{1}\Sigma_{g} - {}^{1}\Sigma_{u}$ в значительной степени определяется расстоянием между фторами и в первом приближении может описываться результатами, приведенными на рис. 3. В кристаллах фтористого лития предполагаемая полоса по-

глощения F_3^- сильно смещена в коротковолновую сторону до 11.3 эВ [8, 9]. Для такого перехода расстояние между фторами должно уменьшиться до величины 1.42 Å, на что нужно затратить значительную энергию 2.8 эВ (рис. 3). По-видимому,

центры F_3^- в LiF требуют дополнительных исследований.

Рассмотрим процесс радиационного образования дефектов в кристаллах LaF_3 -SmF₃. При рентгеновском облучении LaF_3 -SmF₃ наводятся полосы поглощения центров Sm²⁺-анионная вакансия, изученных нами в предыдущей работе [21], а также центры с полосой при 6.2 эВ. На образование центра Sm²⁺-вакансия затрачивается электрон и анионная вакансия. Следовательно, оставшийся междоузельный атом фтора может объеди-

ниться с дыркой с образованием центра F_3^- подобно тому, как это происходит в кристаллах щелочных [22] и щелочно-земельных [9, 12] гало-идов.

Интенсивность полосы поглощения F_3^- -центра относительно полос Yb^{2+} (и других Re^{2+}) значительно больше в кристаллах фторида лантана (рис. 1), чем в кристаллах щелочно-земельных фторидов (рис. 2). Это может быть обусловлено соотношением сил осцилляторов как F₃⁻, так и Yb²⁺ в этих группах кристаллов. Квантово-химический расчет дает близкие силы осцилляторов F₃-центров как в LaF₃, так и в CaF₂. Возможно, разница в интенсивностях обусловлена меньшей силой осциллятора 4f-5d-переходов двухвалентных редкоземельных ионов в LaF₃ по отношению к переходам в щелочно-земельных фторидах. В кристаллах фторида лантана рядом с двухвалентным Sm²⁺ располагается анионная вакансия, выполняющая роль зарядового компенсатора. Возбужденные 5*d*-состояния двухвалентных ионов в LaF₃ будут также распространяться на анионную вакансию, что, несомненно, приведет к уменьшению перекрытия 4f- и 5d-состояний и к уменьшению силы осциллятора перехода 4f-5d.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сравнением спектров поглощения кристаллов фторидов с различными редкоземельными ионами, полученных рентгеновским облучением со спектрами, полученными аддитивным окрашиванием, выделены полосы стабильных при ком-

натной температуре дырочных F₃⁻ центров. Моле-

кулярные ионы F_3^- в кристаллах щелочно-земельных фторидов (CaF₂, SrF₂, BaF₂) и LaF₃ характеризуются широкой полосой поглощения около 6 эВ.

Неэмпирические расчеты кластеров решеток СаF₂ и LaF₃ показывают образование молекуляр-

ного иона F_3^- с энергией перехода, соответствующего ${}^1\Sigma_g - {}^1\Sigma_u$ в свободном ионе и близкой к экспериментальной.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Braida B., Hiberty P.C. // J. Am. Chem. Soc. 2004. V. 126. P. 14890.
- Kloo L. // Comprehensive Inorganic Chemistry II (Second Edition): From Elements to Applications. Elsevier, 2013. V. 1. P. 233–249.
- Varley J.H.O. // J. Nuclear Energy. 1954. V. 1. P. 130– 143.
- 4. Hersh H.N. // Phys.Rev. 1957. V. 105. № 4. P. 1140.
- Winter E. M., Wolf D.R., Christy R.W. // Phys. Rev. 1969. V. 186. № 3. P. 949.
- Ault B.S., Andrews L. // Inorganic Chemistry. 1977. V. 16. № 8. P. 2024.
- Tuinman A.A., Gakh A.A., Hinde R.J., Compton R.N. // J. Am. Chem. Soc. 1999. V. 121. P. 8397.

- Artau A., Nizzi K. E., Hill B.T., Sunderlin L.S., Wenthold P.G. // J. Am. Chem. Soc. 2000. V. 122. P. 10667.
- 9. Фигура П.В., Непомнящих А.И., Раджабов Е.А. // Опт. и спектр. 1989. Т. 67. В. 6. С. 1304.
- 10. *Mayhugh M.R., Christy R.W.* // Phys. Rev. B. V. 2. № 8. P. 3330.
- 11. *Непомнящих А.И., Раджабов Е.А. //* Опт. и спектр. 1980. Т. 48. В. 4. С. 818.
- Rzepka E., Lefrant S., Taurel L. // J. Phys. C: Solid State Phys. 1975. V. 8. P. 2523.
- 13. *Radzhabov E., Nepomnyshikh A.I.* // SCINT 95: Proceedings of the International Conference on Inorganic Scintillators and Their Applications. Delft, The Netherlands, August 28–September 1, 1995. P. 189–192.
- 14. Frisch M.J., Trucks G.W., Schlegel H.B. et al. Gaussian 03. Gaussian, Inc., Wallingford, CT, 2003.
- 15. *Непомнящих А.И., Токарев А.Г., Черняго Б.П., Фигура П.В. //* Письма в ЖТФ. 1991. Т. 17. № 16. С. 1.
- 16. Pimentel G.C. // J. Chem. Phys. 1951. V. 19. P. 446.
- 17. Tasker P.W. // Mol. Phys. 1977. V. 33. № 2. P. 511.
- Cahill P.A., Dykstra C.E., Martin J.C. // J. Am. Chem. Soc. 1985. V. 107. P. 6359.
- 19. Gabes W., Nijman-Meester M.A.M. // J. Am. Chem. Soc. 1985. V. 107. P. 6359.
- Novoa J.J., Mota F., Alvarez S. // J. Phys. Chem. 1988.
 V. 92. P. 6561.
- Раджабов Е.А., Козловский В.А. // Изв. РАН. Сер. физ. 2015 Т. 79. № 2. С. 275.
- 22. *Itoh N.* // Cryst. Lattice Defects. 1972. V. 3. № 3. P. 115.
- 23. Фигура П.В., Непомнящих А.И., Раджабов Е.А. // Опт. и спектр. 1988. Т. 65. В. 4. С. 940.
- Elias L.R., Heaps W.S., Yen W.M. // Phys. Rev. B. 1973.
 V. 8. № 11. P. 4989.